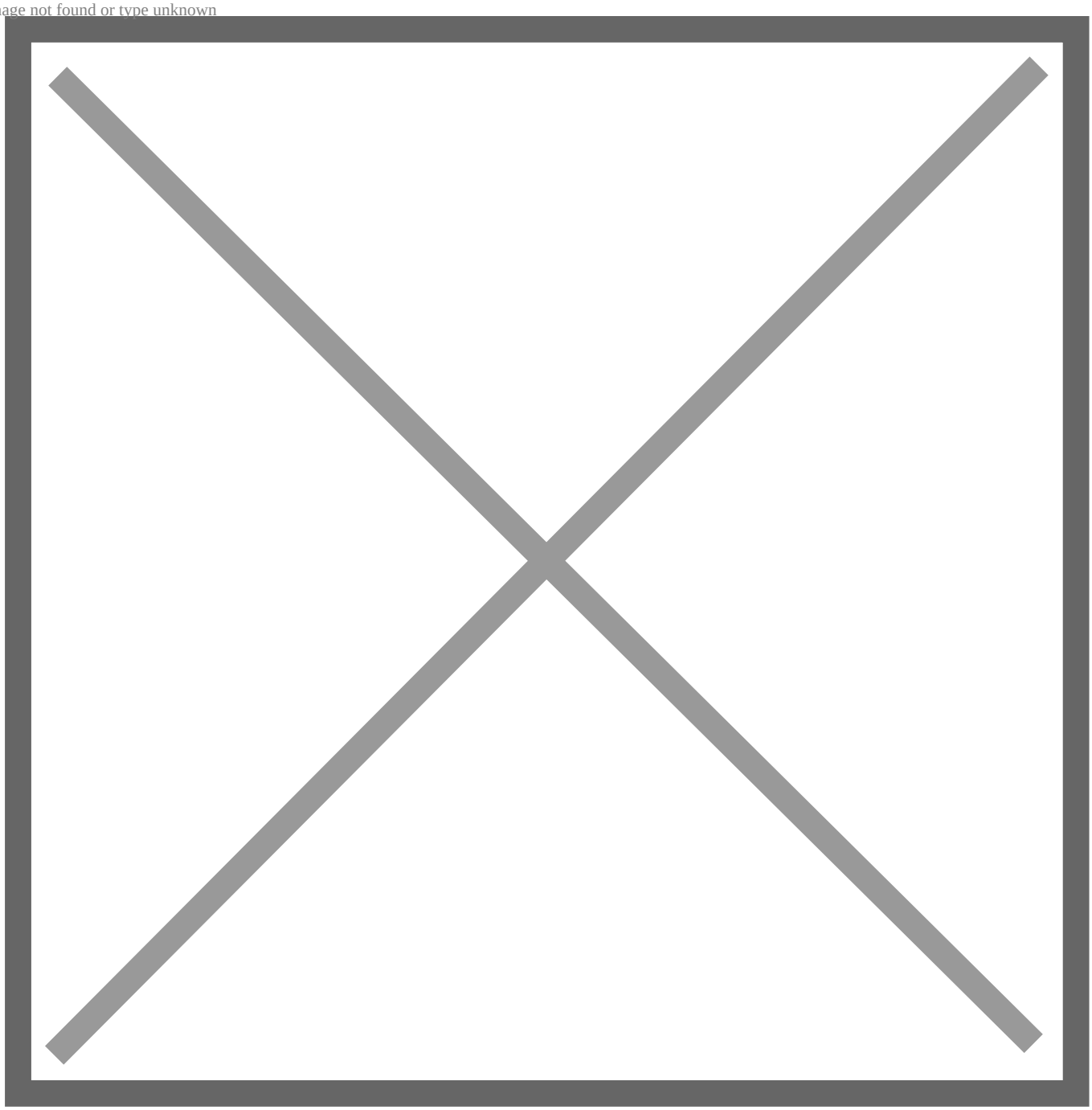
ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Полуавтоматическая станция для измерения пластин серии X

Image not found or type unknown



Цена:

Цена по запросу

Описание

Полуавтоматические зондовые станции серии X

Полуавтоматические зондовые станции серии X предназначены для тестирования пластин диаметром до 300 мм, позволяют проводить измерения при температурах от -60 ℃ до 300 ℃. Возможность управления зондовой станцией с помощью команд SCPI позволяет автоматизировать процесс измерений и минимизировать человеческий фактор при выполнении измерений
Достоинства моделей серии X:

· Тестирование светодиодов/фотодиодов/лазерных диодов (интенсивность излучения/длина волны)
· Измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик тестируемых материалов/изделий
· СВЧ измерения (до 300 ГГц)
· Измерения в широком диапазоне температур
· Скорость перемещения держателя подложек до 70 мм/с

Модель		X6/X8/X12
Держатель подложек	Диапазон перемещения XY	350mm*365mm
	Разрешение XY	0.1мкм
	Повторяемость XY	≦±1мкм
	Скорость перемещения XY	≦70 мм/с
	Z Диапазон перемещения	20мм
	Z Разрешение	0.1мкм
	Z Повторяемость	≦±1мкм
	Z Скорость перемещения	≦20 мм/с
Температурный диапазон	Диапазон	-60°C-300°C
	Стабильность	0.1°C
	Разрешение	0.01°C
Оптическая система с многократным увеличением		Микроскоп с трехскоростным увеличением 15:1, может одновременно показывать изображения с низким, средним и высоким увеличением, легко наводить иглу

Широкое применение	Поддержка тестирования SiC/GaN пластин, тестирование мощных пластин Сменная конструкция держателя пластин для тестирования различных пластин
Функции программного обеспечения	① Поддержка полуавтоматического управления (возможен ручной тест или переход на автоматический)
	② Автоматическое выравнивание пластин
	③ Автоматическое измерение размера матрицы
	④ Автоматическое картирование пластин и удаленный доступ к данным
	⑤ Свободное управление и программирование входных и выходных параметров
	⑥ Быстрая интеграция нескольких тестеров
	⑦ Автоматическая радиочастотная калибровка одной кнопкой, функция автоматической очистки иглы
	⑧Поддержка тестирования по одной точке и непрерывного тестирования
	⑨Автоматическое сохранение данных, синхронная обработка данных
	⑩Классификация результатов тестирования и отображение их разным цветом на карте пластин
	Контроль предельной скорости и блокировка безопасности